

ランチョンセミナー

下記のスケジュールで、ランチョンセミナーを行います。

整理券は発行いたしませんので、当日、当該会場にお並びください。

5月25日(月) 12:00~12:50

LS-1 カールツァイス株式会社 (B会場)

3D 非破壊定量解析を実現する X 線顕微鏡法のワークフローと応用事例

座長：佐藤朗 (カールツァイス株式会社)

発表者：Shaun Graham (Carl Zeiss Microscopy GmbH) and Dr. Liu Nan (Carl Zeiss Pte Ltd)

LS-2 株式会社日立ハイテク (C会場)

日立ハイテクが提供する Correlated Imaging 技術

座長：立花 繁明 (株式会社日立ハイテク)

発表者：相蘇 亨 (株式会社日立ハイテク)

LS-3 日本電子株式会社 (D会場)

座長：山崎 良樹 (科学・計測機器営業本部 SI 販売推進室)

美しい像が未来をつくる～ 新型検出器を搭載した最新 FE-SEM のご紹介

発表者：山口祐樹 (EP 事業ユニット EP アプリケーション部)

FIB-SEM による最新 3D アプリケーションのご紹介

発表者：河野一郎 (科学・計測機器営業本部 SI 販売推進室)

LS-4 サーモフィッシャーサイエンティフィック (E会場)

Spectra ～高生産性と 50 pm 分解能を両立する材料科学研究向け S/TEM システム～

発表者：ブライト アレクサンダー (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

LS-5 株式会社東陽テクニカ (F会場)

Advanced correlation solutions for TESCAN FIB and microCT

座長：鈴木 直久 (株式会社東陽テクニカ)

発表者：Antonin Doupal (TESCAN ORSAY HOLDING)

LS-6 アメテック株式会社 ガタン事業部 (G会場)

Ametek 社 最新試料作成装置と SEM 用分析アクセサリ製品のご紹介

座長：高内 幸一 (アメテック株式会社 ガタン事業部)

発表者：佐伯 哲平 (アメテック株式会社 ガタン事業部)

5月27日(水) 12:00~12:50

LS-7 オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 (B会場)

生物試料をみてみよう~バイオ分野のアナリシス~

座長：五十嵐 誠 (オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社)

発表者：三井 千珠 (オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社)

LS-8 株式会社日立ハイテク (C会場)

材料解析を支援する FIB ソリューション

座長：水野 貴之 (株式会社日立ハイテク)

発表者：佐藤 高広 (株式会社日立ハイテク)

LS-9 サーマフィッシャーサイエンティフィック (D会場)

生体三次元構造解析のためのクライオボリューム 3D イメージング

発表者：甲斐 翼 (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

LS-10 カールツァイス株式会社 (E会場)

ZEISS イオンビーム顕微鏡が切り開く新しいパラダイム：相関顕微鏡ワークフロー、3D トモグラフィー、フェムト秒レーザー加工、SIMS

座長：佐藤 朗 (カールツァイス株式会社)

発表者：Dr. Hanfang Hao (Carl Zeiss Pte Ltd)

LS-11 アメテック株式会社 ガタン事業部 (F会場)

CMOS センサーを使用したガタンの最新装置のご紹介

座長：佐伯 哲平 (アメテック株式会社 ガタン事業部)

発表者：高内 幸一 (アメテック株式会社 ガタン事業部)

LS-12 日本電子株式会社 (G会場)

座長：上野 秀哉 (科学・計測機器営業本部 SI 販売推進室)

IDES 社の最先端高速技術を用いた製品紹介

発表者：沢田 英敬 (EM 事業ユニット)

新製品紹介~超高空間分解能と高感度分析を両立させた収差補正顕微鏡

GRAND ARM™2~

発表者：大西 市朗 (EM 事業ユニット EM アプリケーション部)